

Direct synthesis mechanism of amorphous SiO_x nanowires from Ni/Si substrate

W.Y. Song*, T.I. Shin**, H.J. Lee**, H. Kim**, S.-W. Kim*** and D. H. Yoon***†

*Sungkyunkwan Advanced Institute of Nanotechnology (SAINT), Sungkyunkwan University, Suwon 440-746, Korea

**Dept. of Advanced Materials Engineering, Sungkyunkwan University, Suwon 440-746, Korea

***School of Advanced Materials and System Engineering, Kumoh National Institute of Technology, Gumi 730-701, Korea

(Received November 3, 2006)

(Accepted November 22, 2006)

Abstract The amorphous SiO_x nanowires were synthesized by the vapor phase epitaxy (VPE) method. SiO_x nanowires were formed on silicon wafer of temperatures ranged from 800~1100°C and nickel thin film was used as a catalyst for the growth of nanowires. A vapor-liquid-solid (VLS) mechanism is responsible for the catalyst-assisted amorphous SiO_x nanowires synthesis in this experiment. The SEM images showed cotton-like nanostructure of free standing SiO_x nanowires with the length of more than about 10 μm . The SiO_x nanowires were confirmed amorphous structure by TEM analysis and EDX spectrum reveals that the nanowires consist of Si and O.

Key words Nanowires synthesis, Growth mechanism, Vapor phase epitaxy method

Ni/Si 기판을 사용하여 성장시킨 비결정질 SiO_x 나노 와이어의 성장 메커니즘

송원영*, 신동익**, 이호준**, 김형섭**, 김상우***, 윤대호***†

*성균나노과학기술원, 수원, 440-746

**성균관대학교 신소재공학과, 수원, 440-746

***금오공과대학교, 구미, 730-701

(2006년 11월 3일 접수)

(2006년 11월 22일 심사완료)

요약 Vapor phase epitaxy(VPE)법을 사용하여 amorphous SiO_x nanowires를 성장시켰다. Ni thin film을 촉매로 사용하여 Si 기판위에 800~1100°C 범위의 온도에서 성장시켰으며, SiO_x nanowires의 성장 메커니즘은 Vapor-liquid-solid(VLS)으로 확인되었다. SiO_x nanowires의 shape와 morphology는 scanning electron microscope(SEM)으로 분석하였으며, cotton-like 형태이고 길이는 10 μm 정도였다. 그리고 구조적 특징은 transmission electron microscope(TEM)으로 관찰하였고, SiO_x nanowires의 성분 분석은 energy dispersed X-ray spectroscopy(EDS)로 하였다. EDX spectrum으로 nanowires가 Si와 O로 구성되어졌음을 확인하였다.

1. 서 론

Nanowires와 nanotubes 같은 nanometer의 직경을 가지는 One-dimensional(1D) 구조는 size effect의 기초 현상을 물리적, 광학적, 전기적, 기계적 특성으로 이해하고 응용하는데 있어 중요한 물질로 알려져 있으며 1D 나노구조의 합성은 중요한 나노기술의 한 분야로 인식되고 있다[1, 2]. Silicon과 silica 나노구조는 light-emitting

소자로 응용함에 있어 상당한 이목이 집중되고 있다. Amorphous SiO_x nanowires의 합성 방법으로는 다양한 접근이 있는데, vapor phase transport[3], excimer laser ablation[4], physical and thermal chemical evaporation [5], thermal chemical vapor deposition[6], thermal oxidation[7], 그리고 solution method[8]와 같은 방법이 있다. 이들은 반도체 박막 합성에도 많이 사용되어왔던 기법들이지만 반도체 박막 공정에서와는 달리 nanowires 합성 시 반응 가스를 일정한 유량으로 정확하게 시스템에 공급되게 해야 하는 등 공정상에 어려움이 있다.

본 연구에서는 vapor phase epitaxy(VPE)법을 사용하여 Si 기판위에 Ni 촉매를 사용하여 비정질 SiO_x nanowires

†Corresponding author

Tel: +82-290-7361

Fax: +82-290-7371

E-mail: dhyoon@skku.edu

를 성장시켰다. 촉매로 사용한 Ni이 Si 기판으로 확산되는 현상을 억제해 보고자 TiN buffer layer를 사용하여 실험하였다. 성장된 nanowires은 먼저 SEM(PHILIPS : XL 30 ESEM-FEG) 이미지를 통해 확인하였고, TEM (JEOL : JEM-2100F)과 EDS 분석을 통해 구조적 특성과 성분 조성을 조사하였다.

2. 실험 방법

본 실험에서는 *p*-type silicon (111) wafer를 기판으로 사용하였고 공정전 실시한 sample cleaning은 초음파 세척기를 사용하였다. 촉매로 사용하게 될 Ni thin film은 RF sputtering을 통해 증착하였다. Ni 촉매를 nano particle로 만들기 위해 800~850°C의 chamber에서 NH₃(99.99 %) 가스를 400~500 sccm 단위로 주입하면서 40~50분 단위로 etching 공정 하였다. 준비된 샘플을 기판으로 사용하여 1000~1100°C에서 분위기 가스인 high purity Ar (99.999 %)의 유량을 2000~2500 sccm 으로 조절하면서 40~50분 동안 nanowires를 성장시켰다. 여기서 TiN buffer layer를 Ni과 Si 사이에 증착한 후 같은 실험 조건으로 재차 실험하였다. 이는 온도 변화에 따라 Ni nano particle이 Si 기판 위에서 비정질 SiO_x nanowires의 촉매 작용을 하여 nanowires의 성장 메커니즘을 가능케 하는지 알아보기 위해 실시하였다. 또한 buffer layer에 따른 결정의 구조적 특성의 변화를 관찰하는데 목적을 두었다.

3. 결과 및 고찰

Fig. 1은 Si 기판 위에 높은 밀도로 성장된 비정질 SiO_x nanowires의 SEM 이미지이다. Fig. 1(a)는 cotton-like 모양으로 random하게 성장한 비정질 SiO_x nanowires의 표면 형상이다. 이미지에서 관찰할 수 있듯이 성장된 SiO_x nanowires의 shape과 morphology는 결정질 형태가 아닌 비정질 형태로 보여졌다. 통하여 성장된 SiO_x nanowires는 결정질이 아닌 비결정질로 확인되었다. Fig. 1(b)의 이미지는 SiO_x nanowires의 단면인데 여기서 nanowires의 길이는 약 10 μm이고 직경은 30~100 nm임을 확인 할 수 있다. 일반적으로 고온에서 Ni과 Si은 nickel silicide(NiSi) 화합물을 형성하게 된다. 이때 기판에서 Si원자가 화합물 방향으로 점점 확산되어 표면으로 표출되며 분위기 속의 산소와 결합하여 SiO_x nanowires를 형성하게 된다. Fig. 1(c)은 성장온도가 800~850°C 정도로 낮을 경우의 SEM 이미지이다. 이를 통하여 다음과 같은 사실을 알 수 있었다. 일정 임계온도 이하일 경우 Ni와 Si의 화합물 형성이 억제 되어 SiO_x nanowires가

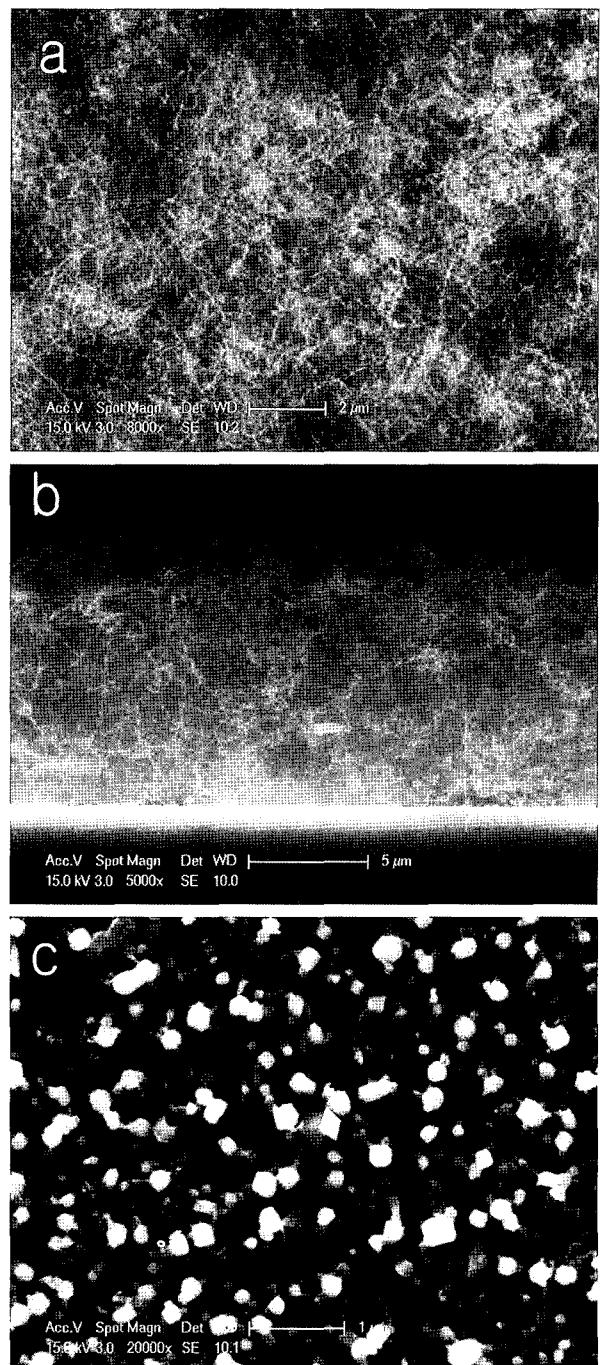


Fig. 1. SEM images of SiO_x nanowires (Ni catalysts/Si substrate) (a) Surface morphology of SiO_x nanowires, (b) Cross-section of SiO_x nanowires, (c) SiO_x nanowires at low temperature (800~850°C).

성장 하지 못하며, 또한 Si의 확산속도가 저하되어 산소와의 결합이 억제되었다. Ni-Si 화합물은 950°C보다 낮은 경우 six stable intermetallic 상으로 존재한다. Ni₂Si 상의 경우 200~350°C 온도 범위에서 관찰되고, 700°C 이상의 온도에서는 NiSi 상으로 존재한다[9].

SiO_x nanowires의 결합식은 $\text{Si} + \text{xH}_2\text{O} = \text{SiO}_x + \text{xH}_2$ 이다.

비정질 nanowires의 합성 메커니즘은 screw dislocation 모델과 Vapor-Liquid-Solid(VLS) 모델이 있는데, 첫번째 모델은 본 연구에서 합성한 비정질 SiO_x nanowires의 성장 메커니즘을 설명하는데 있어 적합하지 않다. 두번째로 Vapor phase에서의 합성을 기반으로 하는 기법 중 VLS 모델은 단결정 구조의 nanowires 대량 합성에 가장 많이 적용되고 있다. 고체 nanowire의 성장은 액체 촉매에 gas-source(vapor) growth medium을 작용시켜 촉매와 eutectic mixture를 만들면서 성장이 시작된다. Ni를 촉매로 하는 Si nanowires 합성을 살펴보면, 먼저 반응로에 촉매 물질인 Ni 박막을 증착한 후 나노 입자 사이즈로 에칭한 sample을 넣고 Ar 가스를 공급하며 고온으로 올리면, Ni 나노 입자 표면에 Si와 quartz tube에 안에 있는 O_2 가 결합하게 되고 용융점 이상에서 Ni-Si 혼합 용액 방울이 형성된 뒤, 과공급되는 O_2 가스에 의해 solid-liquid interface로부터 한 방향으로 nanowires 이 자라게 되는 것이다. 과포화 되어 지는 반응 가스에 의해 solid-liquid interface에서 대칭성이 깨지는 것이 VLS 합성 기법에서 1차원 나노 결정 형성에 중요한 단

계라 할 수 있다. 또한 촉매와 반응가스의 혼합용액 droplet은 nanowires 합성시 일종의 template로 작용한다고 할 수 있으므로 촉매 입자 크기를 조절함에 따라 합성되는 nanowire의 직경을 제어할 수 있다. Nanowire의 길이는 반응시간에 비례하므로 nanowire의 길이 역시 제어 가능하다. VLS 합성기법에서 문제가 되는 것은 합성하려는 nanowires 물질과 잘 맞는 적절한 촉매 물질을 선택하는 것인데, 현재로서는 각 물질들의 equilibrium phase diagram 분석을 통하여 촉매 물질들을 결정하고 있다.

Fig. 2는 TiN 박막을 Si과 Ni 사이에 buffer layer로 증착한 후 성장시킨 SiO_x nanowires의 SEM 이미지이다. Fig. 2(a)는 amorphous SiO_x nanowires 이 제한적으로 성장된 것을 보여준다. Fig. 2(b)는 SiO_x nanowires의 cross-section을 볼 수 있는데 여기서 SiO_x nanowires의 길이는 약 1 μm 이고 직경은 80~100 nm이다. 이 결과를 통하여 TiN buffer layer가 Ni과 Si 사이의 nickel silicide(NiSi) 화합물을 형성을 억제한 것을 알 수 있었다. 실험공정시간이 길어짐에 따라 nickel silicon 화합물이 TiN buffer layer 속으로 확산되어 SiO_x nanowires를 생성하게 된다. 또한 TiN buffer layer는 catalysts 작용을 하는 Ni 이 quartz tube 안에 있는 O와 Si 기판과의 접촉을 방해하는 것으로 보여진다. 이로 인해 SiO_x nanowires의 성장 메커니즘을 자연시키는 작용을 하여 nanowires 직경이 짧아지고 두께가 두꺼워 진다.

Fig. 3(a)와 3(b)는 저배율 및 고배율의 TEM 이미지이다. 성장한 SiO_x nanowires는 비정질 구조인 것으로 확인되었다. Fig. 3(c)는 성장된 SiO_x 의 EDX spectrum이다. 이 Spectrum에서 보여주듯이 성장된 SiO_x nanowires는 Si과 O로 구성되어 있다. 또한 Table 1에서 SiO_x nanowires의 Atomic %를 볼 수 있는데, Si과 O가 1 : 2의 비율로 이루어진 비정질 SiO_2 nanowires임을 확인할 수 있었다. 여기서 C와 Cu가 관찰된 것은 TEM sample grid의 성분이다.

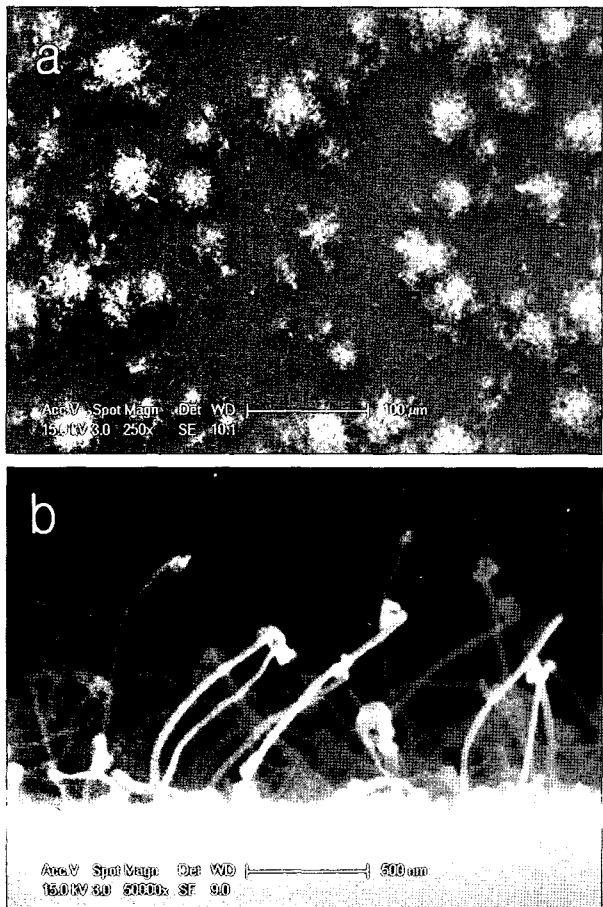


Fig. 2. SEM images of SiO_x nanowires (Ni catalysts/TiN buffer layer/Si substrate) (a) Surface morphology of SiO_x nanowires, (b) Cross-section of SiO_x nanowires.

3. 결 론

VPE법을 사용하여 비정질 SiO_x nanowires를 성장시켰다. 성장 온도는 Ni 박막을 촉매로 사용하여 Si 기판 위에 1000~1100°C 범위의 온도에서 성장시켰다. VLS 메커니즘을 가지고 성장하는 비정질 SiO_x nanowires를 확인할 수 있었다. 성장온도가 낮을 경우 nickel silicon 화합물이 형성되지 않아 SiO_x nanowires 성장이 되지 않았다. Ni 촉매와 Si 기판 사이에 TiN buffer layer를 사용하였을 때 성장이 잘 일어나지 않았다. SiO_2 nanowires 형성 할 때 Ni과 Si가 반응하여 생성된 nickel silicon 화

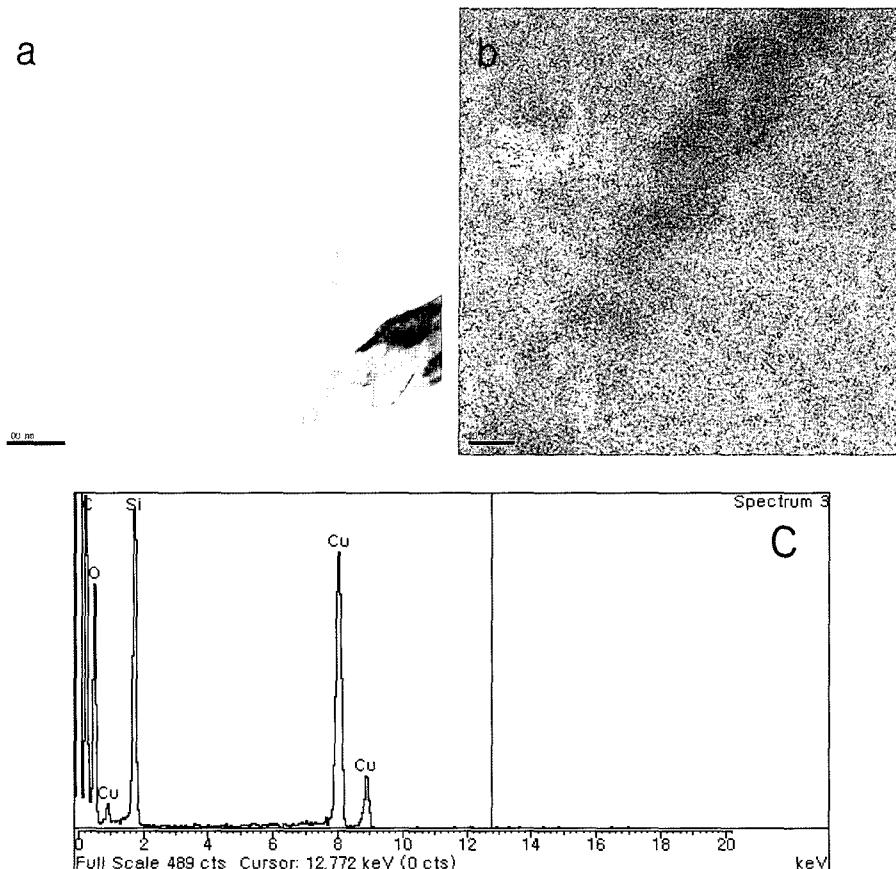


Fig. 3. TEM images of SiO_x nanowires and EDX analysis (a) Low-magnification TEM image of SiO_x, (b) HRTEM image of SiO_x nanowire, (c) Chemical composition of SiO_x nanowire.

Table 1
An EDX spectrum of SiO_x nanowire

Element	Weight %	Atomic %
C _K	29.47	51.82
O _K	18.20	24.02
Si _K	16.12	12.12
Cu _K	36.22	12.04
Totals	100.00	

합물은 성장온도와 buffer layer에 영향을 받는 것으로 확인하였다.

참 고 문 헌

- [1] S. Iijima, "Helical microtubules of graphitic carbon", *Nature (London)* 354 (1991) 56.
- [2] A. Morales and C. Lieber, "A laser ablation method for the synthesis of crystalline semiconductor nanowires", *Science* 279 (1998) 208.
- [3] C.X. Xu, X.W. Sun, M.B. Yu, Y.Z. Xiong, Z.L. Dong

and J.S. Chen, "Magnetic nanocables-silicon carbide sheathed with iron-oxide-doped amorphous silica", *Appl. Phys. Lett.* 85 (2004) 5364.

- [4] Y.Q. Zhu, W.B. Hu, W.K. Hsu, M. Terrones, N. Grobert, T. Karali, H. Terrones, J.P. Hare, P.D. Townsend, H.W. Kroto and D.R.M. Walton, "A simple route to silicon-based nanostructures", *Adv. Mater.* 11 (1999) 844.
- [5] B. Zheng, Y.Y. Wu, P.D. Yang and J. Liu, "Fabrication of single-crystal alpha-Al₂O₃ nanorods by displacement reactions", *Adv. Mater.* 14 (2002) 122.
- [6] Z.Q. Liu, W.Y. Zhou, L.F. Sun, D.S. Tang, X.P. Zou, Y.B. Li, C.Y. Wang, G. Wang and S.S. Xie, "Growth of amorphous silicon nanowires", *Chem. Phys. Lett.* 341 (2001) 523.
- [7] J.Q. Hu, Y. Jiang, X.M. Meng, C.S. Lee and S.T. Lee, "A simple large-scale synthesis of very long aligned silica nanowires", *Chem. Phys. Lett.* 367 (2003) 339.
- [8] C.L. Shao, H. Kim, J. Gong and D. Lee, "Nickel titanate nanofibers by electrospinning", *Nanotechnology* 12 (2002) 635.
- [9] G. L. P. Berning and L. L. Levenson, "Diffusion of nickel in silicon below 475°C", *Thin Solid Films* 55 (1978) 473.